$$m \leq 1 + \frac{(2s+1)b \|z\|^{2/(2s+1)}}{2e(b_1 - 1)^{2/(2s+1)} \delta^{2/(2s+1)}},$$
  
$$\|x_{m,\delta} - x\| \leq [(b_1 + 1)\delta]^{2s/(2s+1)} \|z\|^{1/(2s+1)} + \frac{1}{\sqrt{2b}} \left[1 + \frac{b(2s+1) \|z\|^{2/(2s+1)}}{2e(b_1 - 1)^{2/(2s+1)} \delta^{2/(2s+1)}}\right]^{\frac{1}{2}} \delta.$$
  
(19)

Доказательство.

Из (9) и [1] при n = m - 1 имеем  $\|A(E - A)\|_{\infty} = \|A^{2s+1}(E)\|_{\infty}$ 

$$\|A(E - Ag_{m-1}(A))x\| = \|A - (E - Ag_{m-1}(A))z\| = \|A - (E - Ag_{m-1}(A))$$

Воспользовавшись (18), получаем

$$(b_1-1)\delta \leq \left[\frac{(2s+1)b}{2(m-1)e}\right]^{\frac{2s+1}{2}} \|z\|.$$

Отсюда

$$m \le 1 + \frac{(2s+1)b \|z\|^{2/(2s+1)}}{2e(b_1-1)^{2/(2s+1)}} \delta^{2/(2s+1)}$$

При помощи неравенства моментов и (16) оценим  $\left\| (E - Ag_m(A))x \right\| = \left\| A^{2s} (E - Ag_m(A))z \right\| \le$ 

$$\leq \left\| A^{2s+1}(E - Ag_m(A)) z \right\|^{\frac{2s}{2s+1}} \left\| (E - Ag_m(A)) z \right\|^{\frac{1}{2s+1}} \leq \frac{1}{2s+1} < \frac{1}{2s+1} \leq \frac{1}{2s+1} < \frac{1}{2s+1} < \frac{1}{2s+1}$$

$$\leq \|A(E - Ag_m(A))x\|^{\frac{1}{2s+1}} \|z\|^{\frac{1}{2s+1}} \leq [(b_1 + 1)\delta]^{\frac{2s}{2s}} \|z\|^{\frac{1}{2s+1}} \|z\|^{\frac{1}{2s+1}}$$
  
Torga
$$\|x_{m,\delta} - x\| \leq \|(E - Ag_m(A))x\| + \|g_m(A)(y_{\delta} - y)\| \leq$$

УДК 536.413

# Кушнер Т.Л.

$$\leq \left[ (b_{1}+1)\delta \right]^{\frac{2s}{2}(2s+1)} \|z\|^{\frac{1}{2}(2s+1)} + \frac{1}{\sqrt{2b}} m^{\frac{1}{2}} \delta \leq \\ \leq \left[ (b_{1}+1)\delta \right]^{\frac{2s}{2}(2s+1)} \|z\|^{\frac{1}{2}(2s+1)} + \\ \frac{1}{\sqrt{2b}} \left\{ 1 + \frac{b(2s+1)\|z\|^{\frac{2}{2}(2s+1)}}{2e\left[ (b_{1}-1)\delta \right]^{\frac{2}{2}(2s+1)}} \right\}^{\frac{1}{2}} \delta, \text{ y.t.g.}$$

<u>Замечание 1</u>. Порядок оценки (19) есть  $0(\delta^{2^{s}/(2s+1)})$  и, как следует из [4], он оптимален на классе решений  $x = A^{2s}z_{s}$ , s > 0.

<u>Замечание 2</u>. Знание порядка 2s > 0 истокопредставимости точного решения, используемое в теореме 2, не потребуется на практике, так как при останове по невязке автоматически делается нужное число итераций для получения оптимального по порядку решения.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Савчук В.Ф. Сходимость одного метода решения линейных уравнений в гильбертовом пространстве // Известия АН БССР, серия физ.-мат. наук, №4, 1981.
- 2. Емелин И.В., Красносельский М.А. К теории некорректных задач // Докл. АН СССР. Т.244, №4, 1979.
- Вайникко Г.М., Веретенников А.Ю. Итерационные процедуры в некорректных задачах. – М.: Наука, 1986.
- Вайникко Г.М. Оценки погрешности метода последовательных приближений для некорректных задач // Автоматика и телемеханика, №3, 1980.
- Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. – М.: Наука, 1955.
- Kożuch I., W. Sawczuk. O pewnej metodzie rozwiązywania niepoprawnie zbudowanych zadan // Krajowa konferencja naukowa "Sztuczna inteligencja, 2000", Siedlce, 2000.

# ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРЫ ТРОЙНЫХ СОЕДИНЕНИЙ CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> И CuGa<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>

### введение

Развитие полупроводниковой электроники и микроэлектроники связано с поиском и исследованием новых соединений, позволяющих расширить и дополнить спектр свойств уже освоенных материалов. В последнее время сложные полупроводниковые соединения привлекают всё возрастающее внимание.

Тройные соединения  $A^{I}B^{III}_{3}C_{5}^{VI}$  и  $A^{I}B_{5}^{III}C_{8}^{VI}$  с атомами Cu в позиции A, In или Ga – в B, и Se в позиции C являются перспективными материалами для изготовления солнечных элементов и светодиодов линейно поляризованного излучения. Тройные соединения CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> обладают большим коэффициентом фотоэлектрического поглощения и относительно узкой шириной запрещенной зоны. CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> является полупроводником с большей шириной запрещённой зоны, чем CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>. В настоящее время широко используются как объёмные, так и тонкопленочные материалы, хотя устойчивое получение качественных образцов затруднительно. В связи с этим предъявляются высокие требования к качеству и степени совершенства используемых кристаллов. Соединения  $CuIn_5Se_8$  и  $CuGa_5Se_8$  являются мало изученными материалами. Это связано, скорее, с трудностью получения качественных гомогенных образцов.

Для выбора условий выращивания объемных монокристаллов из расплава, получения эпитаксиальных слоев и гетероструктур высокого качества, понимания электрических, оптических и других свойств полупроводниковых кристаллов важно знать закономерности кристаллического упорядочения атомов в выше названных соединениях.

В данной работе предпринята попытка обобщить результаты исследований структуры тройных соединений CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> и CuGa<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. Кроме того, проведён анализ фазовых диаграмм состояния Cu<sub>2</sub>Se – In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> и Cu<sub>2</sub>Se – Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>.

*Кушнер Татьяна Леонидовна,* ст. преподаватель каф. физики Брестского государственного технического университета. Беларусь, БГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.

В завершение приведена таблица с параметрами кристаллической решётки получаемых соединений, представленных различными авторами.

## ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Напаda Т. и др. [1] отметили, что полученные ими кристаллы CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> не представляли собой моноструктуру, но имели три типа тетраэдров, которые являются подрешётками соединений: CuIn<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>, CuIn<sub>3</sub>Se<sub>4</sub> и In<sub>3</sub>Se<sub>4</sub> с атомами Se в вершинах. Авторы предложили рассматривать новый тип решётки, относящийся к пространственной группе I  $\overline{4}$  2m. Такая структура (ABIn<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>) представлена соединением Cu<sub>0.8</sub>In<sub>0.4</sub>In<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>, где атомы Se и некоторые атомы In занимают узлы с приблизительной координатой 8i и периодом 1/4 по оси х, а также 4d и 1/8 по оси z соответственно. Атомы Cu и остальные атомы In статистически заполняют узлы A(2a) и B(2b). Если сравнивать структуру полученного соединения, то она соответствует скорее структуре с упорядоченными вакансиями, чем дефектного халькопирита. В подтверждение данного предположения были произведены расчёты в работе [2].

Negami T. и др. [3] методом осаждения из трёх источников получили тонкие плёнки CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> с очень хорошей гомогенностью и структурой халькопирита с упорядоченными вакансиями. Высокоразрешающая электронная микроскопия показала, что плёнки CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> имеют столбчатую микроструктуру с большим количеством двойникований на границах в направлении {112}.

Этой же группой получены осаждением тонкие плёнки  $Cu(In_{1-x}Ga_x)_3Se_5$  [4]. При этом поток молекулярных компонентов контролировался из четырёх источников. Содержание Ga изменялось в зависимости от времени осаждения слоёв  $CuIn_3Se_5$  и  $CuGa_3Se_5$ . Подложкой для напыления служило стекло, легированное молибденом. Толщина всей плёнки составляла 2 мкм, а толщина слоёв:  $CuIn_3Se_5 - 18$  нм,  $CuGa_3Se_5 - 15$  нм. Содержание элементарных компонентов в образцах  $CuIn_3Se_5$  составило (в %) для Cu : In : Se = 11,7 : 32,6 : 55,7, для  $CuGa_3Se_5 - Cu : Ga : Se = 11,4 : 32,1 : 56,5$ . С увеличением процентного содержания Ga изменяется структура от дефектного халькопирита (об этом свидетельствует наличие максимумов дифракции 110,202,114) к кубической (цинковой обманки).

Монокристаллы CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> и Cu(In, Ga)<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> были выращены Кіт С.D. и др. [5] методом химических транспортных реакций. Кристаллы имели структуру халькопирита с упорядоченными вакансиями.

В работе Wang H.P. и др. [6] сообщается, что кристаллы Си(In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>)<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> выращены горизонтальным методом Бриджмена. Положительные опыты в лабораторных исследованиях показали, что покрытие части внутренних стенок ампулы углеродом позволяет устранить химическое взаимодействие (прилипание) расплава к ампуле, даже если само покрытие не соприкасается с расплавом во время роста кристалла. В процессе выращивания кристаллов с большим содержанием Ga (х > 0,75) режим нагрева необходимо выдерживать особенно осторожно, т.к. достаточно интенсивная реакция может привести к разлому ампулы. Выращенные кристаллы после внешнего осмотра были разделены на три части: первую, среднюю и последнюю зоны. В последней части слитка обнаружен недостаток меди. В [7] сообщалось, что внешне медьобеднённая фаза выглядит как типично слоистая структура. Аналогично выглядела именно последняя часть кристалла. Различия в композиционном составе слитка можно понять, рассмотрев псевдобинарную фазовую диаграмму. Из диаграмм состояния Cu<sub>2</sub>Se - In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> и Cu<sub>2</sub>Se - Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> видно, что

соединения CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> и CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> плавятся не конгруэнтно. Таким соединениям соответствует 75 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> и Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> на диаграмме. Максимумы ликвидуса находятся в области с большим содержанием Cu<sub>2</sub>Se. Поэтому при охлаждении вероятнее затвердеет первой фаза с высоким содержанием Cu. Хотя образование такой фазы более распространено в системе Cu<sub>2</sub>Se – In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Это связано с тем, что максимум ликвидуса в Cu<sub>2</sub>Se – Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> расположен намного ближе к 75 % Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Кроме того, линия ликвидуса в системе Cu<sub>2</sub>Se – Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> несколько выше, чем в Cu<sub>2</sub>Se – In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Следовательно, при охлаждении быстрее кристаллизуется фаза богатая Ga, чем с избытком In.

Если рассматривать фазовое разнообразие, то CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> (**β**фаза) существует при отношении Cu/In, лежащем в пределах от 0,27 до 0,50, а фаза с недостатком Си (у-фаза) - от 0,11 до 0,22. Части слитка, взятые из первой и средней зоны кристаллизовались в  $\beta$ -фазе, в то время как некоторые кристаллы из последней зоны принадлежали к у-фазе. Дифракционные рентгеновские спектры кристаллов, содержащих  $\boldsymbol{\beta}$ -фазу с различным содержанием In очень похожи. С другой стороны у-фаза даёт совсем отличный спектр. Можно увидеть, что он принадлежит кристаллам с гексагональной или тригональной структурой, а также смеси этих структур [7]. При  $\boldsymbol{x} = 0$  кристаллы CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> имели параметры кристалличекой решётки *а* = 0,5759 нм и c = 1,1524 нм. С увеличением содержания Ga оба параметра уменьшаются. Т.к. кристаллы CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> получены не были, то параметры кристаллической решётки можно для них только оценить, аппроксимируя данные, приведённые для соединений с различным содержанием Ga.

В работе Hönle W. и др. [8] более подробно и детально изучена структура и химический состав  $\beta$ -фазы и  $\delta$ -фазы. Минимальный состав  $\beta$ -фазы 8,69 ат. % Cu, 34,79 ат. % In, 56,52 ат. % Se в двухфазной области. При перитектическом охлаждении смеси осуществляется кристаллизация  $\beta$ -фазы.  $\delta$ -фаза имеет состав 11,99 ат. % Cu, 34,01 ат. % In, 54,00 ат. % Se. Кроме основной  $\delta$ -фазы при температуре выше 750 °C существует эвтектическая смесь  $\delta$ , In<sub>6</sub>Se<sub>7</sub> и InSe. Формульно химический состав может быть определён после нормирования по отношению к Se.  $\beta$ -фазе соответствует формула Cu<sub>0,39</sub>In<sub>1,20</sub>Se<sub>2,00</sub>,  $\delta$ -фазе соответственно Cu<sub>0,46</sub>In<sub>1,18</sub>Se<sub>2,00</sub>. По характеру сколов оба образца можно отнести к монокристаллам. В таблице 1 приведены значения координат атомов компонентов в кристаллические положения атомов в  $\beta$ -фазе с учётом вакансий.

 $\delta$ -фаза имеет типично сфалеритную структуру, где в узлах 4с статистически распределены атомы Cu, In и (вакансии). Положения М могут занимать как атомы меди, так и индия. Но вычисленные факторы заполняемости узлов для обоих компонентов показали, что большую величину имеет фактор для Cu. Поэтому нахождение атомов меди в узлах М наиболее Предложенная формула вероятно. соединения Си<sub>0.54</sub>In<sub>1.15 0.30</sub>Se<sub>2.00</sub> хорошо согласуется с данными химического анализа. Определены расстояния между атомами d<sub>1</sub> (Cu-Se) = 0,2450 нм, d<sub>1</sub> (In-Se) = 0,2535 нм. Простая математическая интерполяция для соотношения 32 % Cu 68 % In даёт величину d (In/Cu-Se) = 0,2477 нм, которая хорошо согласуется с величиной d<sub>0</sub> = 0,2495 нм. Для соединений CuInSe<sub>2</sub> приводятся следующие величины: d (Cu-Se) = 0,2430 нм, d (In-Se) = 0,2580 нм, а для In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> соответственно d (In-Se) от 0,2540 до 0,2620 нм.

Вестник Брестского государственного технического университета. 2003. №5

Атом	37					
11100	у зел	x	x y			
$oldsymbol{\delta}$ -фаза						
Se	4a	0	0	0		
M (Cu)	4c	1/4	1/4 1/4			
$oldsymbol{eta}$ -фаза						
M1 (Cu)	2b	1/2	0	1/4		
M2 (Cu)	2e	0	0	0		
M3 (In)	2f	1/2	1/2	0		
M4 (In)	2d	0	1/2	1/4		
Se	8n	0,25755	0,23537	0,11783		

Таблица 1. Положения атомов в кристаллической решётке

β-фаза относится к пространственной группе Р 4 2с из-за частичного упорядочения катионов. Для такого вида фазы предложено название Р-халькопирит. Только атомы In могут занимать положения М4, т.к. просчитанный для этого случая фактор заполняемости узлов >1. В узлах М2 наиболее вероятно расположение Сu. Расстояния d (M1–Se) = 0,2470 нм, d (M3–Se) = 0,2473 нм. Позиции М1 и М3 могут быть заняты Cu, In или в приблизительно равных пропорциях. В узлах М1 могут располагаться как атомы In так и атомы Cu.

*Таблица 2.* Кристаллографические положения атомов в  $\beta$ -фазе

,			
Se	0,9Se		0,1
M1	0,57In	0,02Cu	0,41
M2		0,68Cu	0,32
M3	0,6In	0,02Cu	0,39
M4	1,0In		

Согласно этим данным кристаллическая формула для исследованного образца должна быть Cu<sub>0,36</sub>In<sub>1,09</sub> <sub>0,55</sub>(Se<sub>0,80</sub> <sub>0,20</sub>). Положения M1 и M3 имеют наибольшую концентрацию вакансий. В качестве заключения можно сказать, что структура дефектного халькопирита имеет две катионных позиции, одна из которых полностью занята In, другая – Cu, In или . Первая позиция соответствует M4, вторая – M1 + M2 + M3. Но предполагается, что с точки зрения свойств нет различий между фазами  $\beta$  и  $\delta$ , а есть только различия в построении атомов в кристаллических решётках.

В статье Marin G. и др. [9] отмечено, что попытки вырастить качественные монокристаллы CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> часто заканчиваются неудачей. Для выращивания монокристаллов в их работе применялся вертикальный метод Бриджмена с и без предварительного синтеза, селенизацией стехиометрической смеси Си и In в жидком состоянии при различных температурах и прямом охлаждении. После многих безуспешных попыток, наилучший результат был получен с двухграммовой навеской, помещённой в плоской ампуле в однозонную горизонтальную печь. Процентное соотношение компонентов в разкристалла CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> было личных частях Cu:In:Se 9,47:29,24:61,28 и 11,72:31,14:57,12. Для CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> соответственно Cu:Ga:Se 11.05:32,27:56,67 и 10,90:32,57:56,35. Рентгеновский анализ показал очень похожие спектры, хотя интенсивность пиков у CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> выше. Вероятно, это вызвано большим упорядочением атомов Си и Ga, по сравнению с атомами Си и In. Рентгеновская дифракция лучей, проведённая для обоих образцов, показала, что и CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, и CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> имеют тетрагональную структуру типа халькопирита.

Группой во главе с С. Manolicas [10] методами электронной микроскопии и электронной дифракции изучена структура соединения Cu<sub>0.5</sub>In<sub>2.5</sub>Se<sub>4</sub> с катион-анионным соотношением 3:4. Кристаллы были выращены из расплава исходных компонентов в кварцевой ампуле, путём охлаждения ниже точки плавления. Далее производились сколы в различных частях слитка и исследовались на электронном микроскопе. На сколах можно наблюдать доменную структуру. Размер доменов зависит, как правило, от температуры и продолжительности отжига. Их границы имеют как размытые, так и чёткие очертания. Часто явно выражена кристаллографическая ориентация {110}. С точки зрения строения вещества, за основу может быть взята кубическая объёмно центрированная решётка, со стороной  $a_0$ . Сверхструктура образуется вследствие упорядочения катионов. Таким образом, можно получить тетрагональную структуру с параметрами  $a = a_0$  и  $c = 2 \cdot a_0$ .

Для соединений  $(AB)_3X_4$  характерна дефектная структура. В частности структура дефектного халькопирита или тиогалла-

та относится к группе, а дефектного станнита – к **4** 2m. Они имеют одинаковый тип упорядочения вакансий, но различное упорядочение катионов A и B. Как правило отношение A:B = 1:2. При любом другом соотношении часть позиций атомов A займут атомы обоих сортов. В соединении  $Cu_{0,5}In_{2,5}Se_4$  A:B = 1:5. Таким образом, возможны расположения атомов, подчиняющиеся двум пространственным группам, описанным выше.

Большинство вышеперечисленных работ посвящено исследованию соединения CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> и лишь несколько – CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. Так, Merino J.M. и другими [2] были выращены поликристаллы соединений CuIn<sub>2</sub>Se<sub>3,5</sub>, CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> и CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. Все соединения синтезированы путём нагрева исходных компонентов, взятых в стехиометрическом соотношении, в кварцевой ампуле с избыточным давлением до 1130 °C со скоростью 10 <sup>0</sup>С/ч. Охлаждение происходило с различной скоростью. Для кристаллизации CuIn<sub>2</sub>Se<sub>3.5</sub>, CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> скорость охлаждения составляла 10 °С/ч, а по достижении 900 °С печь выключалась. С целью получить состав, содержащий две фазы, соединение  $CuIn_5Se_8$  охлаждалось медленнее (5  $^{0}C/ч$ ) в интервале температур от 900 °C до 600 °C. При рентгенофазовом анализе использовалась обработка по методу Ритвельда. В настоящей работе приведена следующая структурная формула соединения CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>: (Cu<sub>0,79</sub>) <sub>2e</sub> (In<sub>0,45</sub>)<sub>2b</sub> (In<sub>0,88</sub>)<sub>2f</sub> (In<sub>1.00</sub>)<sub>2d</sub> (Se<sub>3.6</sub>)<sub>8n</sub>. Рассчитаны параметры кристаллической решётки и межатомные расстояния для обеих структур CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>. Для структуры типа станнита I **4** 2m: a = 0.57562 нм. c = 1.15301 нм. d (Cu-Se)

= 0.22737 нм, d ( $In_{2b}$ -Se) = 0.26766 нм, d ( $In_{4d}$ -Se) = 0.25296 нм. Для структуры типа P-халькопирита P  $\overline{4}$  2c: a = 0,57555 нм, c = 1,15303 нм, d (Cu-Se) = 0.2421 нм, d ( $In_{2b}$ -Se) = 0.2441 нм, d ( $In_{2t}$ -Se) = 0.2491 нм, d ( $In_{2d}$ -Se) = 0.2641 нм. Результаты вычислений показывают, что тетраэдры кристаллической решётки в структуре станнита получают значительное искажение в одном из направлений. Расстояния d (Cu-Se) и d ( $In_{2b}$ -Se) имеют разницу в 0,04 нм, что маловероятно. Как правило,

расстояния между атомами составляют: для Cu-Se - 0,242-

0,245 нм, для In-Se – 0,256-0,260 нм. Что касается соединения CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>, то отмечено лишь существенное отличие спектра дифракции рентгеновских лучей. В соответствии с расположением максимумов спектра подтверждено существование  $\gamma$ -фазы в двух модификациях:  $\gamma_{\mu}$  – гексагональной и  $\gamma_m$  – тетрагональной. Причём, эти модификации сосуществуют в одном образце, как и в [7,11].

Соединение  $CuIn_3Se_5$  может иметь структуру с упорядоченными вакансиями (тиогаллат). Но если нельзя сказать определённо, какие положения в кристаллической решётке занимают вакансии, тогда структуру называют халькопирит-

ной. В работе [11] отмечено, что определить точное расположение вакансий крайне трудно.

Rincon C. и др. [12,13] сообщают, что соедиение с упорядоченными вакансиями CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> кристаллизуется в структуре халькопирита, относящейся к пространственной группе

Р42с, точечной группе **4** 2m. Согласно ранее предложенной теории это соединение формируется путем повторения структурной единицы (2  $V_{Cu}^{1-}$  +  $Ga_{Cu}^{2+}$ ) на каждые 5 элементарных ячеек CuGaSe<sub>2</sub>.

Образцы CuIn<sub>5</sub>S<sub>8-x</sub>Se<sub>x</sub> с различным  $0 \le x \le 8$  получались Наеиseler. Н. и др. [14] при различных температурах охлаждения. Слитки с x = 7 имели гексагональную структуру кристаллической решётки с параметрами a = 0,40152 нм и c = 1,62352 нм. При x = 8 образец получился многофазным.

Группа под руководством Marin G. сообщает о получении кристаллов соединений  $CuGa_5Se_8$  со структурой халькопирита и  $CuIn_5Se_8$  с гексагональной структурой [13].

В таблице 3 приведены значения параметров кристаллической решётки для соединений CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> и CuGa<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. В случае успешного получения монокристаллов строка таблицы помечена буквой «м».

# СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЙ А<sup>1</sup>В<sup>Ш</sup><sub>3</sub>С<sub>5</sub><sup>VI</sup> и А<sup>1</sup>В<sub>5</sub><sup>Ш</sup>С<sub>8</sub><sup>VI</sup>

По сравнению со своими бинарными аналогами  $A^{II}B^{VI}$  соединения  $A^{I}B_3^{III}C_5^{VI}$  имеют ряд структурных особенностей. Структура халькопирита имеет две катионные подрешётки, что приводит к различиям в длине химических связей "металл – халькоген", т.е.  $l_{AC} \neq l_{BC}$ . Вследствие разности электроотрицательностей катионов A и B, окружающих анион C в кристаллической решётке, структура халькопирита характеризуется тетрагональным искажением ( $\delta = 2 - c/a \neq 0$ ). Атомы халькогена смещаются со своих идеальных позиций с тетраэдрической координацией. В связи с этим вводится позиционный параметр  $\sigma = 1/4$  для сфалерита и  $\sigma \neq 1/4$  – для халькопирита.

Структура сфалерита относится к пространственной группе  $\bar{4}$  3m. К пространственной группе  $\bar{4}$  2m относятся структуры халькопирита и станнита. В частности структура дефектного халькопирита или тиогаллата относится к группе  $\bar{4}$ , а дефектного станнита – к  $\bar{4}$  2m. Они имеют одинаковый тип упорядочения вакансий, но различное упорядочение катионов А и В. Как правило отношение A:B = 1:2. При любом другом соотношении часть позиций атомов A займут атомы обоих сортов.  $\beta$ -фаза CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> имеет тетрагональную структуру, относящуюся к пространственной группе P  $\bar{4}$  2c. Для такого вида фазы предложено название P-халькопирит. Пространственные группы I  $\bar{4}$  2m и P  $\bar{4}$  2c не являются подгруппами I  $\bar{4}$  2d. Структуру, относящуюся к пространственной группе I  $\bar{4}$  2d, называют дефектным халькопиритом. Именно в такой модификации кристаллизуется соединение CuInSe<sub>2</sub>. К ней же

может относиться и CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>. Соединение CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> может иметь структуру с упорядоченными вакансиями (тиогаллат). Но если нельзя сказать определённо, какие положения в кристаллической решётке занимают вакансии, тогда структуру называют халькопиритной. Mizutani I. и др. [15] отмечают, что структуру с упорядоченными вакансиями можно определить по наличию пиков

(202) и (114) на рентгендифрактограмме [16]. О тетрагональ-

ной структуре образцов можно судить по наличию пиков (112), (204)(220) и (116)(312).

### ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ Cu<sub>2</sub>Se – In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> и Cu<sub>2</sub>Se – Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>

Система Cu<sub>2</sub>Se – In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Данная система была исследована методами ДТА и РФА в работах [17,18]. В работе [19] проведено уточнение и обобщение. Данные литературы показывают, что тройная система Cu – In – Se изучена далеко не полностью. Результаты исследований приводятся, как правило, для бинарных разрезов Cu<sub>2</sub>Se – In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>.

В области гомогенности при 750 °C образуется соединение CuInSe<sub>2</sub> со структурой халькопирита (α-фаза) и соответствует 47,5-55,0 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Стехиометрическое соединение CuInSe<sub>2</sub> при 810 <sup>0</sup>С трансформируется в разупорядоченную модификацию со сфалеритной структурой ( $\delta$ -фаза).  $\boldsymbol{\beta}$ -фаза соответствует 66.5–79,0 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> при 750 °C, причём она не претерпевает никаких фазовых превращений и плавится при 880 °С. При 930 °С  $\beta$ -фаза, соответствующая 66 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> перитектически разлагается в  $\delta$ -фазу (65 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>) и плавится (80 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>). Согласно данным литературы в интервале 67.6-75,0 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> обнаружены соединения Cu<sub>2</sub>In<sub>4</sub>Se<sub>7</sub> и CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. Палатник описывает данную область как псевдокубическую фазу. Имеются также соединение с кубической структурой (Cu<sub>8</sub>In<sub>18</sub>Se<sub>32</sub>) и тетрагональное, описываемое как  $\beta$ -фаза, Cu<sub>7</sub>In<sub>19</sub>Se<sub>32</sub>. Между 82,0 и 90,0 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> при 750 <sup>0</sup>С наблюдается у-фаза. Она представляет собой типично слоистую структуру, которая видна невооружённым глазом. На сколах можно различить области с различным коэффициентом отражения и различной твёрдостью. Анализ дифракции рентгеновских лучей показывает, что у-фаза существует в двух модификациях: у<sub>н</sub> – гексагональной и у<sub>m</sub> – тетрагональной. Эти модификации могут сосуществовать в одном образце, но ут-фаза образуется преимущественно в случае недостаточного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> в гомогенной области. Модификация у-фазы с избытком In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> начинает плавиться при 865 °C. При 880 °C у-фаза 82 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> разлагается перитектически в β-фазу (78 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>) и плавится (92,5 % мольного содержания In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>). **б**-фаза представляет собой гомогенную область с разупорядоченной структурой CuInSe2. При рентгеновских исследованиях в области высоких температур хорошо подтверждается переход структуры халькопирита в сфалерит. Определить образование  $\delta$ -фазы на разрезе Cu<sub>2</sub>Se – In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> невозможно. Хотя при комнатной температуре о существовании такой фазы в растворе CuInSe2 – In0,42Se0,58 при содержании Cu в пределах 11,0-15,5 % сообщается в [7]. Эта область соответствует недостаточному содержанию Си по отношению к стехиометрическому составу и дефициту Se в сравнении с  $\beta$ фазой. Существование  $\delta$ -фазы в области комнатных температур близко к разрезу Cu<sub>2</sub>Se - In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> говорит о том, что этот разрез является квазибинарным. Многофазная область, расположенная между однофазными областями  $\alpha, \beta$  и  $\delta$  не может быть определена точно. Во-первых, как показывают рентгенодифрактограммы, эти фазы очень похожи. Во-вторых, электронный микрофазовый анализ также не может дать достаточно точный результат из-за малой разницы в составах. Кроме того  $\delta$ -фаза крайне не устойчива. По сравнению с двумя другими lphaфаза имеет типичную эвтектическую структуру.

Вестник Брестского государственного технического университета. 2003. №5

Соединение	Источник	Параметры кристаллической решётки				
	[1]	<b>а</b> = 0,57539 нм	<b>с</b> = 1,15191 нм			
	[2]	<b>а</b> = 0,57555 нм	<b>с</b> = 1,15303 нм			
	[3]	<b>а</b> = 0,5742нм	<b>с</b> = 1,1486 нм			
	[4]	<b><i>a</i></b> = 0,575 нм	<i>с</i> = 1,148 нм			
CuIn <sub>3</sub> Se <sub>5</sub>	[5]	<b><i>a</i></b> = 0,5742 нм	<b>с</b> =1,1450 нм	«M»		
	[6]	<b>а</b> = 0,5759 нм	<b>с</b> = 1,1524 нм	«M»		
	[8]	<b>а</b> = 0,57553 нм	<b>с</b> = 1,15204 нм	«M»		
		<b>а</b> = 0,57624 нм		«M»		
	[9]	<b><i>a</i></b> = 0,57542 нм	<b>с</b> = 1,15383 нм	«M»		
	[22,23]	<b>а</b> = 0,57557 нм	<b>с</b> = 1,1514 нм	«M»		
	[24]	<b>а</b> = 0,5756 нм	<i>с</i> = 1,1514 нм	«М»		
	[28,29,34]	<b>а</b> = 0,57623 нм	<b>с</b> = 1,15174 нм	«M»		
	[31,32]	<b>а</b> = 0,57657 нм	<i>с</i> = 1,14995 нм	«М»		
Cu(In, Ga) <sub>3</sub> Se <sub>5</sub>	[5]	<b>а</b> = 0,5702 нм	<i>с</i> =1,1421 нм	«M»		
	[4]	<b>а</b> = 0,551 нм				
	[6*]	<b>а</b> = 0,54903 нм	<b>с</b> = 1.09676 нм			
CuGa <sub>2</sub> Se <sub>5</sub>	[9]	<b>а</b> = 0,54996 нм	<b>с</b> = 1,09463 нм	«M»		
	[12]	<b>а</b> = 0,54996 нм	<b>с</b> = 1,09463 нм			
	[25,26,33]	<b>а</b> = 0,5496 нм	<b>с</b> = 1,0993 нм	«М»		
	[30,34]	<b>а</b> = 0,54935 нм	<b>с</b> = 1,09501 нм	«M»		
	[31,32]	<b>а</b> = 0,54934 нм	<b>с</b> = 1,09505 нм	«М»		
	[13]	<b>а</b> = 1,20794 нм	<b>с</b> = 4,59729 нм			
CuIn <sub>5</sub> Se <sub>8</sub>	[13]	<b>а</b> = 0,54733 нм	<b>с</b> = 1,09316 нм			
	[27]	<b>а</b> = 0,54683 нм	<b>с</b> = 1,08916 нм	«M»		
CuGa <sub>5</sub> Se <sub>8</sub>	[32,35]	<b>а</b> = 0,54682нм	<b>с</b> = 1,09116 нм	«M»		

Таблин	a 3 1	Папамети	<b>NI 1</b> 21	ристаллинеской	nemëtru	соепинений	CuIn-Se-	CuGa.Se.	CuIn-Se	- H CuGa-S	e
таолиц	<i>a 5.</i> 1	парамен	лы к	ристаллическои	решетки	соединении	Cum3565,	CuOa3565,	Cumpor	8 n CuOa55	5

\*) Значения параметров получены аппроксимацией приведенных в [6] данных

Система Cu<sub>2</sub>Se – Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. В области гомогенности образу-

ется соединение CuGaSe<sub>2</sub> со структурой халькопирита ( $\beta$ фаза) и соответствует 50-58 % мольного содержания Ga2Se3. В данной системе  $\beta$ -фаза упорядочена и разлагается по перитектической реакции при 1050 ± 5 °С. При отклонении от стехиометрического состава CuGaSe<sub>2</sub> возникает двухфазная область ( $\beta + \gamma$ ), а при понижении температуры ( $\beta + \delta$ ). Температура конца плавления сплавов с 40-50 % мольного содержания Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> повышается монотонно, а в интервале 50-80 % – практически не изменяется (1090–1094 <sup>0</sup>C). При 65 % мольного содержания Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> наблюдается максимум температуры солидуса, равный 1092 °С. Линии ликвидуса и солидуса в интервале 55-75 % мольного содержания Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> имеют очень пологий максимум. **б**-фаза представляет собой гомогенную область с 72-88 % мольного содержания Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Соединения с содержанием 75-88 мол. % Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> разлагаются по перитектической реакции при 1068 °С. После синтеза они как правило оказываются неравновесными [20]. 90-100 % мольного содержания  $Ga_2Se_3$  соответствует  $\varepsilon$ -фаза на основе  $B_2^{III}C_3^{VI}$ . Концентрационный интервал существования *є*-фазы в системе Cu<sub>2</sub>Se - Ga<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> значительно меньше, чем аналогичной уфазы в системе Си2Те - Ga2Te3.

В работе [21] было предсказано существование тройных фаз  $A^{I}B_{5}^{III}C_{8}^{VI}$  с тетраэдрической координацией атомов. Особенность такого состава состоит в том, что на две элементарные ячейки кристаллической решётки приходится одна молекула соединения. Поэтому такой состав удобен для упорядочения.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уже на протяжении нескольких лет заведующим кафедрой химии профессором д.х.н. И.В. Боднарем выращиваются кристаллы соединений CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> и CuGa<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Данные соединения были исследованы в институте физики твёрдого тела и полупроводников АН Республики Беларусь. Руководство исследованиями осуществляет старший научный сотрудник лаборатории физики высоких давлений к.ф.-м.н. Н.С. Орлова. Я выражаю глубокую признательность этим людям, а также другим соавторам, за помощь, доверие и большую научную школу. Хочу выразить свою благодарность заведующему кафедрой физики БГТУ к.ф.-м.н. А.А. Гладыщуку за понимание и поддержку.

В данной работе в качестве обобщения приведены ранее опубликованные параметры кристаллической решётки соединений CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> и CuGa<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. Методы получения кристаллов и исследования различных их свойств описаны в [22-35].

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Hanada T., Yamana A., Nakamura Y., Nittono O., Wada T. Crystal-Structure of CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> Semiconductor Studied Using Electron and X-Ray Diffraction // Japanese Journal of Applied Physics. Part 2 – Letters. – 1997. – Vol. 22, Iss 11B. – P. L1494–L1497.
- Merino J.M., Mahanty S., Leon M., Diaz R., Rueda F., Martin de Vidales J.L. Structural characterization of CuIn<sub>2</sub>Se<sub>3,5</sub>, CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> and CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> compounds // Thin Solid Films. – 2000. – № 361–362. – P. 70–73.

- Negami T., Kohara N., Nishitani M., Wada T. Preparation of Ordered Vacansy Chalcopyrite-Type CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> Thin-Films // Japanese Journal of Applied Physics. Part 2 – Letters. – 1994. – Vol. 33, Iss 9A. – P. L1251–L1253.
- Negami T., Kohara N., Nishitani M., Wada T., Hirao T. Preparation and Characterization of Cu(In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>)<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> thin films // Appl. Phys. Lett. – 1995. –Vol. 67, № 6. – P. 825–827.
- Kim C.D., Jin M.S., Kim W.T. Growth and Characterization of Ordered Vacancy Chalcopyrite CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> and Cu(In, Ga)<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> Single-Crystals // Journal of Korean Physical Society. – 1998. –Vol. 32, Iss 5. – P. 750–753.
- Wang H.P., Lam W.W., Shih I. Crystal growth of Cu(In<sub>1</sub>, <sub>x</sub>Ga<sub>x</sub>)<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> by horizontal Bridgman method // Journal of Crystal Growth. – 1999. – Vol. 200. – P. 137–142.
- Boenke U.-C., Kühn G. Phase relations in the ternary system Cu - In - Se // Journal of materials science. - 1987. - Vol. 22. - P. 1635-1641.
- Hönle W., Kühn G., Boehnke U.-C. Crystal Structures of Two Quenched Cu - In - Se Phases // Cryst. Res. Technol. - 1988.
  Vol. 23, № 10/11. - P. 1347-1354.
- Marin G., Tauleigne S., Guevara R., Delgado J.M. et al. Crystal Growth, Structural Characterization and Room Temperature Band Gap of CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> and CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // 11<sup>th</sup> International Conference on Ternary and Multinary Compounds: Book of Abstracts Salford, 8 – 12 September 1997 / Salford, 1997. – P. 573–577.
- 10. C. Manolicas, J. van Landuyt, R. de Ridder, S. Amelinckx. Electron Microscopic Study of the Domain Structure and of the Transition State in  $Cu_{0.5}In_{2.5}Se_4$  // Phys. stat. sol. 1979. Vol. 55(a). P. 709–722.
- Tseng B.H., Wert C.A. Defect-ordered phases in a multiphase Cu-In-Se material // Journal of Applied Physics. – 1989. – Vol. 65, № 6. – P. 2254–2257.
- Schmid D., Ruckh M., Grunwald F., Schock H.W. Chalcopyrite/defect chalcopyrite heterojunctions of the basis of CuInSe<sub>2</sub> // Journal of Applied Physics. – 1993. – Vol. 73, № 6. – P. 2902–2909.
- Rincon C., Wasim S.M., Marin G., Hernandez E., Sanchez Perez G., Galibert J. Photoluminescence, infrared reflectivity and Raman spectra of the ordered vacancy compound Cu-Ga<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // Journal of Applied Physics. – 2000. – Vol. 87, № 5. – P. 2293–2296.
- Marin G., Marquez R., Guevra R., Wasim S.M. et al. Crystal Growth and Optical Characterization of Ordered Vacancy Compounds of the I-III<sub>3</sub>-VI<sub>5</sub> and I-III<sub>5</sub>-VI<sub>8</sub> Families // Jpn. J. Appl. Phys. – 2000. – Vol. 39, Suppl. 39-1. – P. 44–45.
- 15. Haeuseler. H., Elitok. E., Memo. A., Osnowsky A. Materials with layered structures: X-ray powder diffraction investigation in the system  $CuIn_5S_8$ - $CuIn_5Se_8$  and  $AgIn_5S_8$ - $AgIn_5Se_8$  // Materials Research Bulletin. 2001. Vol. 36. P. 737–745.
- Mizutani I., Nakanishi H., Chichibu S. Growth and Band-gap Estimation of CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> Polycrystalline Thin Films // Jpn. J. Appl. Phys. – 2000. – Vol. 39, Suppl. P1–95.
- Hayakawa A., Mizutani T., Nacanishi H., F. Chichibu S. Growth and Band-gap Estimation of CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> Polycrystalline Thin Films // Jpn. J. Appl. Phys. – 2000. – Vol. 39, Suppl. 95-1. – P. 162–163.
- Палатник Л.С., Белова Е.К. Исследование закономерностей в полупроводниковых системах типа A<sub>2</sub><sup>I</sup>C<sup>VI</sup>– B<sub>2</sub><sup>III</sup>C<sub>3</sub><sup>VI</sup>// Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1967. – Т.3, № 12. – С. 2194–2202.
- Палатник Л.С., Рогачёва Е.И. Диаграмма равновесия и структуры некоторых полупроводниковых сплавов А<sub>2</sub><sup>1</sup>C<sup>VI</sup> – В<sub>2</sub><sup>III</sup>C<sub>3</sub><sup>VI</sup>// Доклады АН СССР. – 1967. – Т.174, № 1. – С. 80–83.
- 20. Конешова Т.И., Бабицына А.А., Калинников В.Т. Исследование взаимодействия в тройной системе Cu<sub>2</sub>Se In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>

- Se // Известия АН СССР. Неорганические материалы. - 1982. - Т.18, № 9. - С. 1483-1486.

- 21. Палатник Л.С., Белова Е.К., Атрощенко, Ю.Ф. Комник. Кристаллография. – 1965. – Т.10, С. 474.
- Химия алмазоподобных проводников / под ред. Горюновой Н.А. – Л.: Изд-во ЛГУ. –1963.
- 23. Н.С.Орлова, И.В.Боднарь, Т.Л.Кушнер. Получение и структурные свойства соединения Culn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // Тезисы докладов на X Международной технической конференции "Сложные оксиды, халькогениды и галогениды для функциональной электроники". Ужгородский университет, 26-29 сентября 2000 г. – Ужгород, 2000. – С. 74.
- 24. Т.Л.Кушнер. Выращивание кристаллов и структурные исследования CuIn<sub>3</sub>Se<sub>3</sub> // Брест. Вестник БГТУ. Физика. Математика. Химия. 2000. № 5. С. 11—13.
- 25. Кушнер Т.Л., Маркевич Ю.А. Выращивание монокристаллов тройных соединений CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // Тезисы докладов IX республиканской научной конференции студентов, магистров и аспирантов «Физика конденсированных сред». Гродно, 2-4 мая 2001, Гродно, 2001. С. 186–187.
- 26. Кушнер Т.Л. Выращивание кристаллов CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> и определение их структуры // Тезисы докладов IX республиканской научной конференции студентов, магистров и аспирантов «Физика конденсированных сред». Гродно, 2-4 мая 2001 г. — Гродно, 2001. — С. 184—185.
- Кушнер Т.Л. Выращивание кристаллов CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, исследование их структуры и фотолюминесценции. // Вестник БГТУ. Физика. Математика. Химия. 2001. № 5. С. 30.
- Кушнер Т.Л. Радюш Ю.В. Выращивание кристаллов CuGa<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> и определение их структуры // Х республиканская научная конференция «Физика конденсированного состояния». Тезисы докладов студентов, магистрантов и аспирантов. — Гродно, 24-26 апреля 2002, — Гродно, 2002. — С. 184—186.
- 29. Н.С.Орлова, И.В.Боднарь, Т.Л.Кушнер. Получение, структура и тепловое расширение соединения CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // Неорганические материалы, 2002. Т. 38, № 1, С. 7–11.
- 30. N.S.Orlova, I.V.Bodnar, T.L.Kushner. Preparation, Structure, and Thermal Expansion of CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // Inorganic Materials. – Vol. 38, № 1. – 2002. – P. 3–7. Translated from Neorganicheskie Materialy. – Vol. 38, № 1. – 2002. – P. 7–11.
- Н.С.Орлова, И.В.Боднарь, Т.Л.Кушнер. Синтез и физикохимические свойства соединения CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // Журнал неорганической химии. — 2002. — Т. 47, № 10. — С. 1450—1453.
- 32. N.S.Orlova, I.V.Bodnar, T.L.Kushner, E.A.Kudritskaya. Crystal Growth and Properties of the Compounds CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> and CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // Crystal Res.Technology. 2002. Vol.37, № 6. P.540–550.
- 33. N.S.Orlova, I.V.Bodnar, T.L.Kushner. Stryctural and Physical-Chemical Properties of the Ternary Compounds CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub>, CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> and CuGa<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> // 13<sup>th</sup> International Conference on Ternary and Multinary Compounds. Book of Abstracts Paris, 14-18 October 2002 / Paris, 2002. – Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris. – P. 175.
- 34. И.В.Боднарь, Т.Л.Кушнер, В.Ю.Рудь, Ю.В.Рудь, М.В.Якушев. Фотоэлектрические свойства структур In/CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> и In/CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // Журнал прикладной спектроскопии. – 2002. – Т. 69, № 4. – С. 520–522.
- 35. Н.С.Орлова, И.В.Боднарь, Т.Л.Кушнер. Выращивание монокристаллов и исследование свойств соединений CuIn<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> и CuGa<sub>3</sub>Se<sub>5</sub> // 1-я международная украинская научная конференция по физике полупроводников УНКФП-1. Тезисы докладов. — Одесса, 10-14 сентября 2002, — Одесса, 2002. — Т. 2. — С.230—231.
- 36. N.S.Orlova, I.V.Bodnar, T.L.Kushner Preparation, structure, and thermal properties of CuGa<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> // Crystal Res. Technology. – 2003. – Vol.38, № 2. – P.125–132.